

УДК 537.312.62

© 1991

## КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В КЕРАМИКЕ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ ( $6.0 < y \leq 7.0$ )

Ф. Н. Буханько, Н. А. Дорошенко, В. И. Каменев,  
Л. В. Лукьяненко, В. А. Мишин, Л. Т. Цымбал,  
С. Н. Кудряшова

Экспериментально исследованы зависимости параметров решетки, температуры перехода в сверхпроводящее состояние, СВЧ диэлектрической проницаемости и спектров ЭПР от кислородного индекса в керамике  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  ( $6.0 < y \leq 7.0$ ). При критических значениях  $y = 6.3, 6.45$  и  $6.65$  наблюдались резкие изменения свойств, связанные с образованием упорядоченных структур кислорода в  $\text{CuO}$  слоях. Рассмотрены микроскопические модели структурных, электронных и магнитных фазовых превращений в системе  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , вызванных интеркалированием кислорода.

Известно, что изменение содержания кислорода в соединениях  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , вызванное термообработкой, приводит к структурным фазовым превращениям, тесно связанным с изменениями электронных и магнитных свойств. Увеличение кислородного индекса  $y$  в основном обусловлено ростом концентрации интеркалированного кислорода в  $\text{CuO}$  базисных плоскостях. Для описания процесса заполнения  $\text{CuO}$  слоев кислородом и образования упорядоченных структур в ряде работ была использована двумерная модель Изинга, что позволило произвести строгий расчет фазовой диаграммы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  [1-3]. Предполагалось, что при заполнении кислородных вакансий в  $\text{CuO}$  слоях возникают пары соседних ионов кислорода, отличающиеся по величине и знаку взаимодействия друг с другом. В парах  $\text{O}-\text{Cu}-\text{O}$  соседние ионы кислорода разделены медью и притягиваются, что способствует формированию кластеров в виде  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочек по мере заполнения базисных плоскостей. В парах  $\text{O}-\text{O}$  ближайших и дальних соседей анионы кислорода отталкиваются друг от друга вследствие кулоновского взаимодействия, что препятствует образованию пар ближайших соседей кислорода и вызывает расталкивание  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочек, возникающих при заполнении базисных  $\text{CuO}$  плоскостей. Учет сил притяжения и отталкивания в кислородных парах позволил объяснить существование нескольких упорядоченных структур интеркалированного кислорода в модели квадратной решетки Изинга и рассчитать фазовую диаграмму  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , во многом согласующуюся с экспериментальными результатами [2]. Недостатком рассмотренных моделей фазовых переходов является отсутствие учета изменений электронной и магнитной структур при интеркаляции кислорода. Дальнейшее развитие микроскопической теории фазовых превращений в соединениях  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  нуждается в комплексном экспериментальном исследовании.

Целью данной работы являются установление взаимосвязи между структурными фазовыми переходами и изменением электронных и магнитных свойств в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  ( $6.0 < y \leq 7.0$ ), а также изучение природы концентрационных фазовых переходов в этих соединениях. Для этого проведено детальное экспериментальное исследование зависимостей параметров решетки, СВЧ диэлектрической проницаемости и парамагнит-

ной восприимчивости, измеренных при 300 К, а также температуры перехода в сверхпроводящее состояние от концентрации интеркалированного кислорода в нескольких партиях образцов иттриевой керамики.

## 1. Методика приготовления образцов

Исходные образцы керамики  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  были синтезированы взаимодействием в интервале температур 750—900 °С нитрата бария (ч. д. а.) окислов меди (ч. д. а.) и  $\text{Y}_2\text{O}_3$  (марки МГР), взятых в мольном соотношении 2 : 3 : 0.5 соответственно. Синтезированный порошкообразный продукт прессовался под давлением 3.7 т/см<sup>2</sup> в диски размером 15×2 мм и спекался при температуре 950—970 °С в течение 5 ч с последующим охлаждением со скоростью 150 °С/ч до комнатной температуры с промежуточными выдержками по 2—3 ч при температурах 900 и 550 °С. Полученные таблетки представляли собой однофазную, по рентгеновским данным, сверхпроводящую керамику с ромбической симметрией решетки и  $T_c \approx 90$  К. Чтобы избежать влияния возможного разброса свойств в различных таблетках на результаты эксперимента, мы использовали для получения каждой партии образцов одну из таблеток, разделив ее на десять равных частей-сегментов. Для получения образцов с различным значением кислородного индекса использовался общепринятый метод закалки образцов в жидком азоте после достижения равновесия между кислородом в образце и атмосфере при выбранных температурах отжига  $T_a$  в интервале 400—950 °С. Закаленные сегменты керамики растирались в мелкий порошок в агатовой ступке, который в дальнейшем являлся объектом исследования с помощью различных методов.

## 2. Методы исследования

Определение кислородного индекса производилось методом термогравиметрии с помощью лабораторных аналитических весов ВЛР-200, позволяющих определять массу образца с точностью не хуже  $\pm 1.5 \cdot 10^{-4}$  г. На основе гравиметрических данных были рассчитаны и построены кривые относительного изменения кислородного индекса, калибровка которых проводилась с помощью рентгена.

Метод дифракции рентгеновских лучей использовался в данной работе для контроля гомогенности образцов, калибровки кривых  $y(T_a)$ , а также для установления особенностей в изменениях параметров решетки, вызванных изменением стехиометрии образцов. Рентгенографические исследования проводились на дифрактометре ДРОН-1.5 в медном излучении. Определение параметров  $a$ ,  $b$  и  $c$  кристаллической решетки производилось по рефлексам рентгенограмм (200), (020) и (006) соответственно.

Для измерения температуры перехода в сверхпроводящее состояние использовался общепринятый метод диамагнитного отклика. Запись диамагнитного отклика производилась на частоте 1 МГц в интервале температур 4.2—100 К. За температуру  $T_c$  принималась температура, соответствующая началу перехода в сверхпроводящее состояние.

Измерения диэлектрической проницаемости  $\epsilon_{\text{СВЧ}}$  проводились на частоте  $f = 9.2$  ГГц резонансным методом по изменению частоты нагруженного образцом резонатора [4]. Для измерений использовался высокодобротный цилиндрический резонатор, в котором возбуждалось колебание  $H_{011}$ . В этом случае возможно исследование материалов с относительно высокими значениями поляризуемости и потерь. Образец в виде порошка засыпался в тонкую стеклянную ампулу, расположенную вдоль оси цилиндрического резонатора. Сдвиг частоты резонатора, пропорциональный действительной части комплексной диэлектрической проницаемости  $\epsilon$  ( $q$ ,  $\omega$ ), происходил за счет взаимодействия образца с азимутальной компонентой электрического поля. Измерение изменений частоты колебания резонатора  $\delta f$  производилось с помощью электронно-счетного

частотомера ЧЗ-46; при этом использовалась автоматическая подстройка частоты задающего СВЧ генератора по рабочему резонатору.

Метод ЭПР в данной работе использовался с целью обнаружения и изучения свойств локализованных магнитных моментов. Запись спектров ЭПР производилась на промышленной установке SE/X-2544 фирмы «Радиопан» на частоте  $f=9.4$  ГГц. Использование образцов в виде порошков позволило уменьшить влияние экранирования микроволнового поля и формы образца на результаты эксперимента и повысить чувствительность записи спектров ЭПР.

### 3. Результаты и обсуждение

Исходные таблетки исследованных нами образцов иттриевой керамики имели кислородный индекс, близкий к семерке. Термогравиметрические кривые, построенные для различных партий, мало отличались. Значительный выход кислорода из образцов при изобарическом отжиге в воздушной атмосфере наблюдался лишь при температурах выше  $400^{\circ}\text{C}$ . Вблизи  $700^{\circ}\text{C}$  имело место резкое ускорение выхода кислорода, отмеченное нами также при проверочной термообработке образцов в равновесных условиях без последующей их закалки в жидким азоте. Согласно

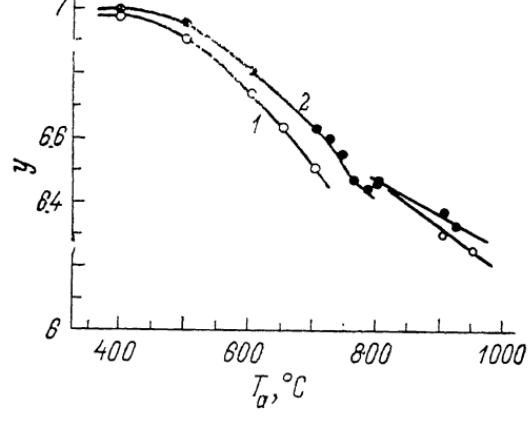


Рис. 1. Зависимости кислородного индекса от температуры отжига.  
1, 2 — первая и третья партии иттриевой керамики.

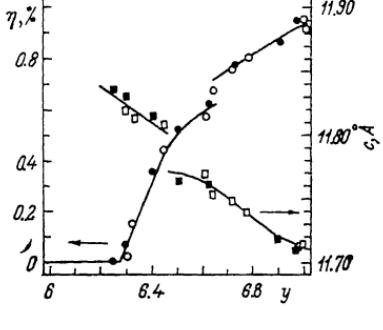


Рис. 2. Зависимости параметров кристаллической решетки от кислородного индекса.

Светлые и темные точки — первая и вторая партии иттриевой керамики.

рассчитанным зависимостям кислородного индекса от температуры отжига (рис. 1), вблизи  $y \approx 6.45$  наблюдался аномальный излом графиков. Аномалия скорости выхода кислорода более детально исследована нами для третьей партии керамики. Из рис. 1 видно, что при температуре отжига  $T_a \approx 700^{\circ}\text{C}$ , соответствующей индексу  $y \approx 6.5$ , происходит непрерывное ускорение выхода кислорода, которое по мере роста температуры замедляется с выходом на плато и сопровождается небольшим скачком содержания кислорода вблизи  $y \approx 6.45$  при температуре отжига  $800^{\circ}\text{C}$  в сторону роста кислородного индекса. Значительно больший скачок кислородного индекса при той же температуре отжига наблюдался нами в диспрозиевой керамике. При температурах отжига выше  $800^{\circ}\text{C}$  скорость выхода кислорода значительно меньше, чем при промежуточных температурах. При этом зависимость  $y$  от температуры отжига близка к линейной.

Зависимости параметров решетки  $a$ ,  $b$  и  $c$  от содержания интеркалированного кислорода в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  также носят немонотонный характер. Как видно из рис. 2, при значениях  $6.0 < y < 6.3$  решетка имеет тетрагональную симметрию. Ромбические искажения, определяемые параметром ромбичности  $\eta = (b-a)/(b+a)$ , появляются вблизи  $y \approx 6.3$  и линейно

растут с ростом кислородного индекса. Вблизи  $y \approx 6.5$  наблюдается замедление роста  $T_c$ , что приводит к образованию плато в интервале  $6.45 < y < 6.65$ . Вблизи критического значения  $y = 6.65$  происходит скачкообразное увеличение ромбичности решетки. В интервале значений  $6.65 < y \leq 7.0$  ромбические искажения линейно растут с ростом концентрации кислорода в  $\text{CuO}$  слоях со скоростью, значительно меньшей, чем в интервале  $6.3 < y < 6.45$ . Концентрационная зависимость параметра  $\epsilon$  в исследованном нами интервале значений  $y$  близка к линейной, но также содержит две особенности — скачок вблизи  $y \approx 6.45$  и плато в интервале  $6.45 < y < 6.65$  (рис. 2). Следует отметить, что аналогичные скачки и плато структурных параметров наблюдались нами также и в диспрозиевой керамике.

Как видно из рис. 2, 3, сверхпроводимость и ромбические искажения решетки в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  появляются одновременно вблизи  $y \approx 6.3$ . Особо следует отметить наличие плато в зависимостях структурных параметров

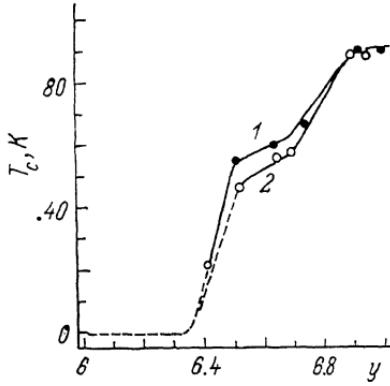


Рис. 3. Зависимости температур перехода в сверхпроводящее состояние от кислородного индекса.

1, 2 — первая и вторая партии иттриевой керамики.

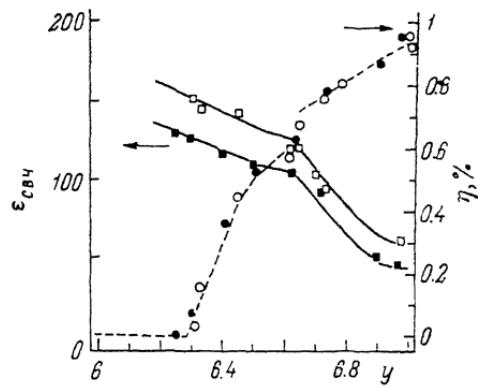


Рис. 4. Зависимости СВЧ диэлектрической проницаемости и параметра  $\epsilon$  кристаллической решетки от кислородного индекса.

Светлые и темные точки — первая и вторая партии иттриевой керамики.

и температуры перехода в сверхпроводящее состояние  $T_c$  при одних и тех же значениях кислородного индекса, соответствующих областям стабилизации орто-I фазы с  $T_c \approx 90$  К и орто-II фазы с  $T_c \approx 50$  К. При промежуточных значениях кислородного индекса температура перехода в сверхпроводящее состояние линейно уменьшается по мере роста дефицита кислорода.

Согласно [2], упорядоченные фазы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  существуют только вблизи значений  $y = 6.0, 6.5$  и  $7.0$ , а при промежуточных значениях реализуются двухфазные смеси состояний. Полученные нами плато в зависимостях структурных параметров и  $T_c$  от кислородного индекса соответствуют областям стабильности упорядоченных структур. Согласно нашим результатам, при комнатной температуре тетрагональная фаза устойчива в области значений  $6.0 < y \leq 6.3$ . В тетрагональной фазе кислородные позиции в  $\text{CuO}$  базисных плоскостях заняты случайно и сверхпроводимость в образцах отсутствует. Из рис. 2, 3 следует, что сверхпроводящая ромбическая орто-I фаза с высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние  $T_c \approx 90$  К устойчива в области значений  $6.85 < y \leq 7.0$ . В этой фазе  $\text{CuO}$  базисные плоскости содержат  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочки, направленные вдоль  $b$ -оси, которые чередуются с цепочками упорядоченных кислородных вакансий [3]. Вблизи  $y = 6.5$ , согласно данным электронной микроскопии высокого разрешения [5], наблюдается устойчивая ромбическая орто-II фаза с удвоенной вдоль  $a$ -оси элементарной ячейкой и  $T_c \approx 50$  К. Границами устойчивости орто-II фазы следует считать, согласно рис. 2, 3, значения  $y = 6.45$  и  $6.65$ , при которых скачком меняются структурные параметры. Согласно [2], вблизи  $y = 6.5$  находится бикритическая точка

фазовой диаграммы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , где встречаются две линии переходов второго рода и две границы фазовых переходов первого рода. В этой связи скачок параметра  $c$  вблизи  $y=6.45$  можно объяснить, по-видимому, пересечением границы нестабильности структурного упорядочения типа спиралей. В областях значений  $y$ , соответствующих на фазовой диаграмме областям стабилизации ромбических фаз, полученные нами концентрационные зависимости параметров  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  имеют плато. Следует отметить, что поведение структурных параметров согласуется с рассчитанными с помощью двумерной модели Изинга зависимостями от  $y$  параметра ближнего порядка для  $\text{O}-\text{Cu}-\text{O}$  кислородных пар [2].

Известно, что с увеличением количества интеркалированного кислорода в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  концентрация свободных носителей (дырок) растет пропорционально изменению кислородного индекса, что приводит к непрерывному понижению уровня Ферми и соответственно к монотонному изменению электронных и магнитных свойств. Однако вблизи перехода из тетрагональной фазы в ромбическую происходят также фазовый переход полупроводник—металл и исчезновение антиферромагнитного упорядочения в  $\text{CuO}_2$  слоях, что должно проявиться в концентрационных зависимостях таких свойств, как проводимость, диэлектрическая проницаемость и магнитная восприимчивость. Диэлектрическая проницаемость проводящих материалов содержит вклады, связанные с поляризуемостью кристаллической решетки, локализованных и свободных носителей. С учетом специфической слоисто-цепочечной структуры поляризуемость свободных носителей  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  сильно анизотропна и состоит из двух частей, обусловленных поляризуемостью  $\alpha_1(\mathbf{q}, \omega)$  цепочек  $\text{Cu}-\text{O}$  и поляризуемостью  $\alpha_2(\mathbf{q}, \omega)$  слоев  $\text{CuO}_2$  [6, 7]. Поляризуемости носителей  $\alpha_{1,2}(\mathbf{q}, \omega)$  весьма сложно зависят от  $\nu_{1,2}$  плотностей состояний на плоских участках поверхностей Ферми,  $p_{F_1}$ ,  $p_{F_2}$  — фермиевских импульсов в цепочках и слоях, а также от величины и направления волнового вектора  $\mathbf{q}$  и частоты  $\omega$ , на которой производится измерение диэлектрической проницаемости [6].

Нами получено, что в полупроводниковой фазе иттриевой керамики ( $y \leq 6.4$ ), когда свободных носителей в образце относительно мало, СВЧ диэлектрическая проницаемость  $\epsilon_{\text{СВЧ}} \approx 150$  и обусловлена в основном поляризуемостью кристаллической решетки и межзонными переходами, что хорошо согласуется с результатами измерений  $\epsilon$  в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , проведенных на низких частотах [8]. По мере роста кислородного индекса и соответственно концентрации носителей СВЧ диэлектрическая проницаемость, согласно рис. 4, уменьшается до значения  $\epsilon_{\text{СВЧ}} \approx 50$  для  $y \approx 7.0$ , что является необычным для большинства проводящих материалов. На графике можно выделить три участка с различной зависимостью  $\epsilon_{\text{СВЧ}}$  от  $y$ , соответствующих тетрагональной и ромбическим структурам. В орто-II фазе вблизи  $y=6.5$  СВЧ диэлектрическая проницаемость слабо зависит от концентрации интеркалированного кислорода, тогда как в тетрагональной и орто-I фазах  $\epsilon_{\text{СВЧ}}$  линейно уменьшается с ростом  $y$ , причем для  $y > 6.65$  скорость уменьшения диэлектрической проницаемости резко возрастает.

Необычную зависимость  $\epsilon_{\text{СВЧ}}$  от кислородного индекса можно качественно объяснить с помощью приближенных выражений для  $\epsilon(\mathbf{q}, \omega)$ , полученных для  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , с учетом низкочастотных возбуждений плазмы свободных носителей [6, 7]. В случае сильно отличающихся значений плотности состояний на плоском участке поверхности Ферми в цепочках  $\nu_1$  и слоях  $\nu_2$  спектр плазменных колебаний  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  распадается на высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ) ветви с анизотропным квазиакустическим законом дисперсии. Вклад в СВЧ диэлектрическую проницаемость могут давать только возбуждения НЧ плазмонов. Согласно [7], НЧ квазидвумерные плазмоны могут возбуждаться в  $\text{CuO}_2$  слоях при условии  $\nu_1 \ll \nu_2$ , которое выполняется в тетрагональной фазе, где практически отсутствуют  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочки. В этом случае для волновых векторов  $\mathbf{q}$ , лежащих в базисных плоскостях  $\epsilon(\mathbf{q}, \omega) \sim \epsilon_i [1 - \omega_2^2(\mathbf{q})/\omega^2]$ ,

где  $\epsilon$  — часть диэлектрической проницаемости, обусловленная поляризуемостью связанных электронов ионных остовов и межзонными переходами, а  $\omega_2(\mathbf{q})$  — частота НЧ квазидвумерных плазмонов, пропорциональная плазменной частоте носителей в  $\text{CuO}_2$  слоях. Следовательно, рост концентрации свободных носителей в слоях должен приводить, согласно приведенной формуле, к уменьшению диэлектрической проницаемости. В ромбической орто-I фазе, по-видимому, выполняются условия, при которых  $\epsilon(\mathbf{q}, \omega) \sim \epsilon_0 [1 - \omega_1^2(\mathbf{q})/\omega^2]$ , где  $\omega_1(\mathbf{q})$  — частота НЧ квазиодномерных плазмонов, возбуждаемых в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках, пропорциональная плазменной частоте носителей. В этом случае резкое увеличение скорости уменьшения  $\epsilon_{\text{СВЧ}}$  вблизи  $y \approx 6.65$  можно объяснить изменением размерности возбуждаемых НЧ плазмонов, вызванное переходом в орто-I фазу. Следует отметить, что, согласно [7], усиление межэлектронного притяжения в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках за счет обмена виртуальными квазиодномерными НЧ плазмонами позволяет также понять причину повышения  $T_c$  до 90 К при переходе из орто-II в орто-I фазу. Для выяснения справедливости высказанных предположений необходимо дополнительное экспериментальное и теоретическое исследование.

Известно, что антиферромагнитное (АФ) упорядочение локализованных магнитных моментов в соединениях  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  существует только при значениях  $y < 6.4$  и связано с ионами  $\text{Cu}^{2+}$  в  $\text{CuO}_2$  слоях [9]. С помощью рассеяния нейтронов установлено уменьшение магнитного момента меди с ростом содержания кислорода [10]. Одной из причин уменьшения называют квантовые флуктуации магнитного момента, вызванные флуктуациями валентного состояния [11]. При  $y = 6.0$  в базисных  $\text{CuO}$  плоскостях отсутствуют атомы кислорода, а медь находится в немагнитном  $\text{Cu}^+$  ( $3d^10, S=0$ ) электронном состоянии. Введение кислорода сопровождается повышением валентности меди до  $\text{Cu}^{2+}$  ( $3d^9, S=1/2$ ) и появлением локализованных в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках магнитных моментов. Можно ожидать монотонного увеличения локализованных в цепочках магнитных моментов, пропорционального концентрации интеркалированного кислорода вплоть до перехода полупроводник—металл, сопровождающегося, по-видимому, делокализацией магнитных моментов. Согласно [12], при переходе полупроводник—металл ионы  $\text{Cu}^{2+}$  в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках поставляют свободные дырки в плоскости  $\text{CuO}_2$ , при этом ожидается уменьшение валентности некоторой части ионов меди в цепочках до  $\text{Cu}^+$  и соответственно изменение магнитных свойств  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ .

Метод ЭПР позволяет идентифицировать парамагнитные локализованные состояния и с высокой точностью определять изменения их концентрации. Во всех образцах иттриевой керамики при 300 К нами был зарегистрирован сигнал ЭПР, соответствующий парамагнитным центрам с  $S=1/2$ , анизотропным  $g$ -фактором и концентрацией спинов  $N_s \sim (10^{15} - 10^{16}) \text{ г}^{-1}$ , который часто связывают с ионами  $\text{Cu}^{2+}$  в дефектной позиции в  $\text{CuO}$  слоях. Мы считаем, что регистрируемый нами спектр ЭПР соответствует в основном ионам  $\text{Cu}^{2+}$ , занимающим позиции Cu (1) на концах или пересечениях  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочек, возникающих при формировании двойниковской структуры иттриевой керамики. Плотность таких локализованных состояний, согласно данным ЭПР, мала, и они, по-видимому, образуют уровень, расположенный в валентной зоне  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  вблизи уровня Ферми.

При фазовом переходе полупроводник—металл спектр менял форму от ромбического с  $g_1=2.047$ ,  $g_2=2.089$ ,  $g_3=2.232$  для  $y < 6.45$  к аксиальному с  $g_\perp \approx g_1=2.047$  и  $g_\parallel=g_3=2.190$  для  $y > 6.45$ . Изменение формы линии поглощения при фазовом переходе можно объяснить «размазыванием» структуры ромбического спектра  $\text{Cu}^{2+}$  вследствие уширения индивидуальных компонент порошкового спектра, вызванного появлением обменного взаимодействия со свободными носителями в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках. При понижении температуры образца  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  наблюдались формирование ромбической компоненты спектра ЭПР и слабая аномалия  $g_\parallel$  вблизи

105 К. Магнитная восприимчивость образца  $\chi_{\text{ЭПР}}$ , пропорциональная концентрации парамагнитных центров, подчинялась закону Кюри в интервале температур 90–300 К с небольшим скачком вблизи 200 К. Ниже перехода образца в сверхпроводящее состояние  $T_c \approx 90$  К интенсивность сигнала ЭПР резко уменьшалась.

Согласно данным ЭПР, в тетрагональной фазе  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , для значений  $6.0 < y \leq 6.3$  плотность локализованных спинов растет по мере увеличения содержания кислорода и выходит на максимум вблизи  $y=6.3$ , где, согласно рис. 2, появляются ромбические искажения. Вблизи  $y=6.45$  имеет место резкое уменьшение  $\chi_{\text{ЭПР}}$ , которое коррелирует со скачком параметра с кристаллической решетки и, по-видимому, вызвано переносом заряда между цепочками и слоями при фазовом переходе полупроводник–металл. Следует отметить, что аналогичный скачок  $\chi_{\text{ЭПР}}$  наблюдался нами вблизи  $y=6.45$  для диспрозиевой керамики. Изме-

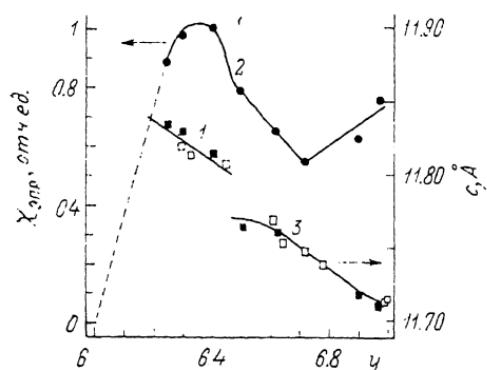


Рис. 5. Зависимости ЭПР (1), парамагнитной восприимчивости (2) и параметра  $C$  кристаллической решетки (3) от кислородного индекса.

Светлые и темные точки — первая и вторая партии иттриевой керамики.

рения статической магнитной восприимчивости в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ , также свидетельствует о наличии максимума  $\chi$  вблизи  $y=6.3$  [13] и резких изменений магнитной восприимчивости вблизи  $y \approx 6.4$  [9]. Причем, согласно [9], вблизи  $y \approx 6.4$  происходило скачкообразное уменьшение концентрации локализованных магнитных моментов, которое сопровождалось скачком нелокальной магнитной восприимчивости, что находится в хорошем соответствии с представлениями о резком усилении переноса заряда между цепочками и слоями. В области стабилизации орто-II фазы  $\chi_{\text{ЭПР}}$  линейно уменьшается с ростом  $y$ , что можно объяснить уменьшением энергетической щели между  $E_F$  и уровнем локализованных состояний. Согласно данным ЭПР (рис. 5) и статической магнитной восприимчивости [9], концентрация локализованных магнитных моментов в металлической фазе иттриевой керамики имеет минимум на границе между орто-I и орто-II фазами, что не согласуется с монотонным понижением  $E_F$  и ростом нелокальной магнитной восприимчивости в этих фазах по мере увеличения концентрации интеркалированного кислорода. Рост концентрации локализованных магнитных моментов в орто-I фазе для  $y > 6.65$  может быть вызван найденным нами значительным уменьшением диэлектрической проницаемости в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках. Кроме рассмотренной линии поглощения ионами  $\text{Cu}^{2+}$ , в спектре ЭПР при 300 К присутствует слабая узкая линия с изотропным  $g$ -фактором ( $g=2.15$ ), который растет с понижением температуры. Согласно [14], эта линия поглощения соответствует возбуждению спиновых волн, что необычно при столь высоких температурах и возможно лишь при наличии очень сильного обменного взаимодействия между ионами  $\text{Cu}^{2+}$  в  $\text{Cu}-\text{O}$  цепочках. Представляет интерес обнаруженное нами резкое увеличение интенсивности этой линии поглощения в несколько раз на границе между орто-I и орто-II фазами.

Авторы благодарны З. Ф. Кравченко за помощь в изготовлении образцов.

#### Список литературы

- [1] Binder K., Landau D. P. // Phys. Rev. B. 1980. V. 21. N 5. P. 1941–1962.
- [2] Wille L. T., Berera A., de Fontaine D. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. N 11. P. 1065–1068.

- [3] McKinnon W. R., Post M. L., Selwyn L. S. et al. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 10. P. 6543—6551.
- [4] Брандт А. А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М., 1963. 403 с.
- [5] Reyes-Gasga J., Krekels T., Van Tendeloo G. et al. // Physica C. 1989. V. 159. N 6. P. 831—848.
- [6] Yu J., Massida S., Freeman A. J., Koeling D. D. // Phys. Lett. 1987. V. 122. N 3, 4. P. 202—208.
- [7] Пашинский Э. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 1. С. 46—55.
- [8] Ищук В. М., Квичко Л. А., Семиноженко В. П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 49. № 6. С. 341—342.
- [9] Köhler U. // Physica C. 1989. V. 159. N 4. P. 491—495.
- [10] Tranquada J. M., Moudden A. H., Goldman A. I. et al. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 4. P. 2477—2487.
- [11] Anderson P. W., Baskaran G., Zou Z., Hsu T. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 58. N 26. P. 2790—2793.
- [12] Avignon M., Benneman K. H. // Sol. St. Comm. 1989. V. 69. N 10. P. 949—1004.
- [13] Алексашин Б. А., Богданович А. М., Верховский С. В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. № 5. С. 263—266.
- [14] Lue J. T., Wu P. T. // Sol. St. Comm. 1988. V. 66. N 1. P. 55—58.

Донецкий физико-технический институт  
АН УССР

Поступило в Редакцию  
10 декабря 1990 г.